

LABORATÓRIO 3 - SIMULAÇÃO DE PORTAS LÓGICAS NAND E NOR

Fernando Moraes
11/setembro/2023

Objetivo deste laboratório

Analisar a influência do número de **transistores em série** no atraso das portas lógicas e a **posição do chaveamento** (qual entrada está mudando de estado).

Fazer download dos arquivos necessários ao laboratório

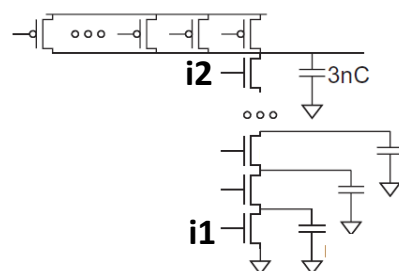
```
wget https://fgmoraes.github.io/microel/lab3/nand6.sp
wget https://fgmoraes.github.io/microel/lab3/nor6.sp
wget https://fgmoraes.github.io/microel/lab3/st65.scs
```

Arquivo que descreve as portas NAND, de 2 a 6 entradas

Abrir o *netlist* nand6.sp e observar neste arquivo (na linha 2 há a data de atualização: 11/set/23):

- ☐ Linha **11**: processo 65nm
- ☐ Linha **14**: `.param Cload=4fF mob=2.45 wp=0.5 wn='2*wp/mob'`, onde:
 - **Cload**: carga de saída de cada porta NAND
 - **mob**: relação de mobilidade (μ_n/μ_p) para esta tecnologia
 - **wp**: dimensão W_P em μm
 - **wn**: dimensão W_N em μm ($2*wp/mob$)
- ☐ Linha **86**: tensão de alimentação (`vcc vcc 0 dc 1.0`)
- ☐ linhas **87** e **88**: comandos PWL (geração dos estímulos para as entradas i1 e i2)
- ☐ linhas **89** e **92**: tensão fixa em '1.0' nas entradas intermediárias da pilha série (i3, i4, i5, i6)
- ☐ Linhas **23-30**: descrição *spice* da porta lógica NAND3. Transistores P em paralelo, e os transistores N em série.

```
.SUBCKT nand3 o1 i1 i2 i3 vcc
M1 o1 i1 vcc vcc psvtgp w=wp l=0.06
M2 o1 i2 vcc vcc psvtgp w=wp l=0.06
M3 o1 i3 vcc vcc psvtgp w=wp l=0.06
M10 0 i1 4 0 nsvtgp w=wn l=0.06
M11 4 i3 2 0 nsvtgp w=wn l=0.06
M12 2 i2 o1 0 nsvtgp w=wn l=0.06
.ENDS nand3
```



- **i2** é a entrada que está variando mais próxima da **saída**
- **i1** é a entrada que está mudando de estado mais próximo de **gnd**
- as demais entradas (i3 a i6) ficam em 1, para os transistores N em série conduzirem

- ☐ **Dimensionamento dos transistores.** Para estudarmos o efeito dos transistores em série, manteremos o dimensionamento das portas NAND (NAND2 a NAND6) igual ao dimensionamento da porta NAND2

Os transistores P, na porta NAND2, por estarem em paralelo, possuem o mesmo dimensionamento. Neste exemplo: **0.5** μm . Os transistores N, em **série**, devem ter a relação de

mobilidade (*mob*) respeitada, devendo ter o dimensionamento de um inversor equivalente, seguindo o princípio do método *logic effort* (inverso da soma dos inversos).

Para a NAND2:

$$W_P = W_N * mob \rightarrow W_N = \frac{W_P}{mob}$$

$$\frac{1}{1/W_N + 1/W_N} = \frac{W_P}{mob}$$

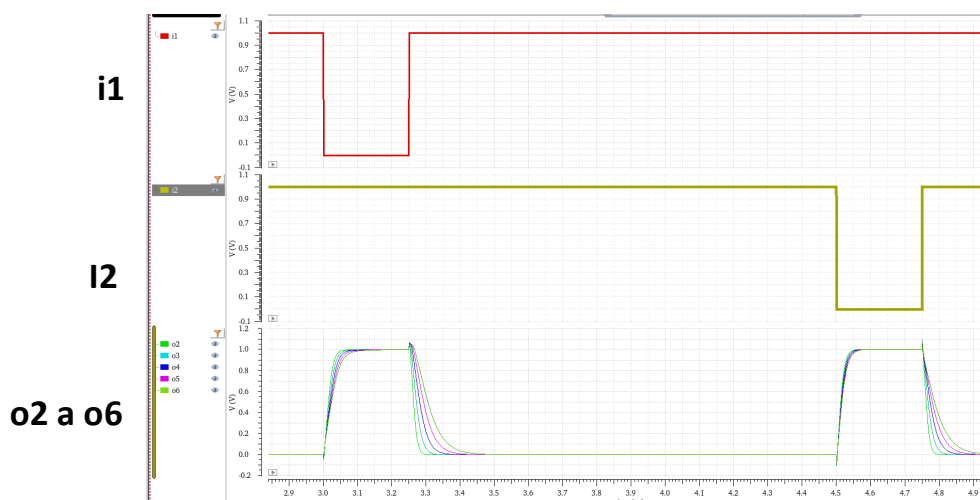
$$W_N = \frac{2 * W_P}{mob} = \frac{2 * 0,5}{2,45} = 0,41 \quad (\text{conforme acima: } wn = '2 * wp / mob')$$

Simulação da porta NAND [6 pt]

RESPONDER:

- [1 pt] Apresentar as formas de onda com as entradas (i1 e i2) e as saídas das portas lógicas *nand* de 2 a 6 entradas, como abaixo. Comparar a formas de onda com a descrição dos estímulos. Por exemplo:

v1 i1 0 pw1(0 1.0 3n 1.0 3.001n 0 3.25n 0 3.251n 1.0)



Preencher a tabela abaixo para as portas NAND (acessar o arquivo *nand6.measure*). **O NETLIST SPICE PRECISA SER COMPLETADO COM AS MEDIDAS DAS NANDS 3 a 6.**

N# Entradas	descida_out (ps) - fo	descida_gnd (ps) - fs	subida_out (ps) - ro	subida_gnd (ps) - rs
2	16,1131	17,4086	16,3744	18,5525
3				
4				
5				
6				

Os tempos são gerados no arquivo *measure*:

descida_out:	t2_2_fo	t2_3_fo	t2_4_fo	t2_5_fo	t2_6_fo	(fall out – transição i2 próximo à saída)
descida_gnd:	t1_2_fs	t1_3_fs	t1_4_fs	t1_5_fs	t1_6_fs	(fall gnd - transição i1 próximo à gnd)
subida_out:	t4_2_ro	t4_3_ro	t4_4_ro	t4_5_ro	t4_6_ro	(rise, transição em i2)
subida_gnd:	t3_2_rs	t3_3_rs	t3_4_rs	t3_5_rs	t3_6_rs	(rise, transição em i1)

- [1 pt] Plotar **um** gráfico com **4 curvas**, uma para cada coluna da tabela acima. No eixo X teremos o número de entradas, e no eixo Y o atraso em pico-segundos para as 4 curvas.

3. [1 pt] Como pode-se explicar o impacto do número de transistores em série no plano N na porta NAND no tempo de propagação de descida?
4. [0,5 pt] O tempo de propagação de descida é mais afetado quando a entrada que varia está próxima de gnd ou da saída? Explicar a razão.
5. [0,5 pt] Porque o tempo de propagação de subida aumenta, apesar de os transistores P estarem com o mesmo dimensionamento e em paralelo?
6. [1,0 pt] Utilizando o método *logic effort* alterar o dimensionamento dos transistores N (sugestão, criar parâmetros w_2, w_3, w_4, w_5 e $w_6 \rightarrow w_2 = '2 * w_p / mob, w_3 = \dots$) de tal forma que o tempo de propagação de descida próximo à saída ($t_{2_2_fo}, \dots, t_{2_6_fo}$) para as 5 portas NAND sejam praticamente iguais (haverá uma diferença de 1,493 ps apenas). Preencha a tabela abaixo.

N# Entradas	descida_out (ps)	descida_gnd (ps)	subida_out (ps)	subida_gnd (ps)
2	16,1097	17,4087	16,3757	18,5628
3				
4				
5				
6				

A diferença observada em **descida_out** conferiu com os 1,493 ps?

7. [1 pt] Plotar um gráfico com 4 curvas (como na questão 3), usando os tempos obtidos na questão 7. Qual dos 4 tempos foi o mais penalizado (descida vdd, descida out, subida out, subida vdd)? Por quê?

Simulação da porta NOR [4 pt]

- **Escrever o netlist para simular portas NOR, de 2 a 6 entradas**. Utilizar o arquivo disponibilizado como modelo.

```
* circuitos nor
simulator lang=spectre insensitive=no
include "st65.scs"
simulator lang=spice
```

```
.param Cload=4fF mob=2.45 wn=0.2 wp='wn*mob*2'
```

```
.SUBCKT      nor2  o1    i1    i2    vcc
M1  10      i1    vcc    vcc    psvtgp    w=wp    l=0.06
M2   o1     i2    10    vcc    psvtgp    w=wp    l=0.06
M10  0      i1    o1     0      nsvtgp    w=wn    l=0.06
M11  0      i2    o1     0      nsvtgp    w=wn    l=0.06
.ENDS nor2
```

```
.SUBCKT nor3 o1 i1 i2 i3 vcc * Lembrar: entrada i1 próxima à vcc e entrada i2 próxima à saída
... completar ...
.ENDS nor3
```

```
.SUBCKT      nor4  o1 i1 i2 i3 i4 vcc
... completar ...
.ENDS nor4
```

```
.SUBCKT      nor5   o1 i1 i2 i3 i4 i5 vcc
... completar ...
.ENDS nor5
```

```
.SUBCKT      nor6   o1 i1 i2 i3 i4 i5 i6 vcc
... completar ...
.ENDS nor6
```

```

** circuito propriamente dito
X1 o2 i1 i2 vcc nor2
X2 o3 i1 i2 i3 vcc nor3
X3 o4 i1 i2 i3 i4 vcc nor4
X4 o5 i1 i2 i3 i4 i5 vcc nor5
X5 o6 i1 i2 i3 i4 i5 i6 vcc nor6

```

```

** alimentações

```

```

vcc vcc 0 dc 1.0

```

```

v1 i1 0 pw1(... completar ...)

```

```

v2 i2 0 pw1(... completar ...)

```

```

v3 i3 0 dc 0 **** entradas não utilizadas

```

```

v4 i4 0 dc 0 **** devem estar em 0 (zero)

```

```

v5 i5 0 dc 0

```

```

v6 i6 0 dc 0

```

```

.tran 0.001N 10N *** tempo de simulação aumentado para 10 ns

```

```

C11 o2 0 Cload

```

```

C12 o3 0 Cload

```

```

C13 o4 0 Cload

```

```

C14 o5 0 Cload

```

```

C15 o6 0 Cload

```

```

.measure tran n2_subida_vdd trig v(i1) val=0.5 td=2n fall=1 targ v(o2) val=0.5 rise=1

```

```

.measure tran n2_descida_vdd trig v(i1) val=0.5 td=2n rise=1 targ v(o2) val=0.5 fall=1

```

```

.measure tran n2_subida_out trig v(i2) val=0.5 td=2n fall=1 targ v(o2) val=0.5 rise=2

```

```

.measure tran n2_descida_out trig v(i2) val=0.5 td=2n rise=2 targ v(o2) val=0.5 fall=2

```

```

.measure tran t_SU_V_2 param = '1e12*n2_subida_vdd'

```

```

.measure tran t_DE_V_2 param = '1e12*n2_descida_vdd'

```

```

.measure tran t_SU_O_2 param = '1e12*n2_subida_out'

```

```

.measure tran t_DE_O_2 param = '1e12*n2_descida_out'

```

```

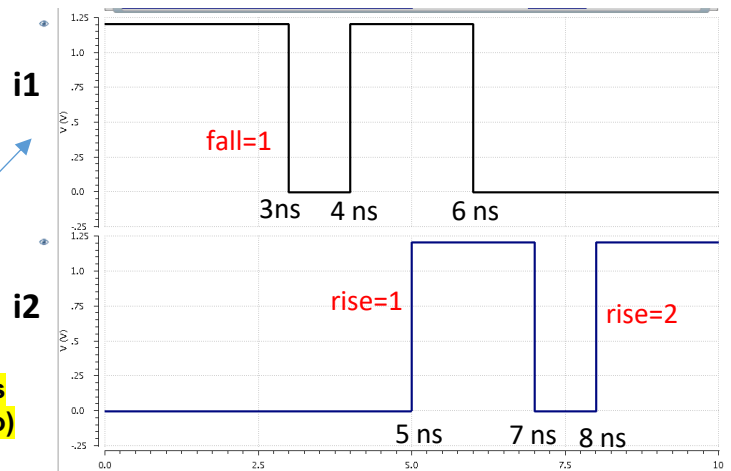
...completar as medidas para outras NOR...

```

```

.END

```



lembrar que o slew (rampa) das entradas *i1* e *i2* deve ser 1ps.

RESPONDER:

- [1 pt] Apresentar as formas de onda com as entradas (*i1* e *i2*) e as saídas das **nor** 2 a 6 entradas (questão semelhante à 1 da simulação das portas *nand*)
- [2 pt] Para as portas NOR fazer uma **tabela** equivalente à NAND e plotar um gráfico com **4 curvas**, uma para cada coluna da tabela. No eixo X teremos o número de entradas, e no eixo Y os tempos de propagação.

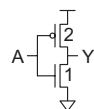
Valores iniciais para referência:

N# Entradas	descida_out (ps)	descida_vcc (ps)	subida_out (ps)	subida_vcc (ps)
2	19,6353	24,8842	17,4871	20,0721
3				
4				
5				
6				

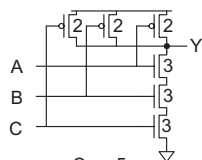
- [0,5 pt] Como pode-se resumir o impacto do número de transistores em série na porta NOR em função do número de transistores em série no plano P no **tempo de propagação de subida**?
- [0,5 pt] O **tempo de propagação de subida** é mais afetado quando a entrada que varia está próxima de vcc ou da saída? Explicar a razão.

MATERIAL PARA CONSULTA:

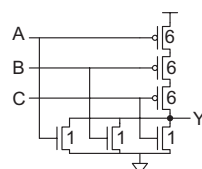
Livro: RABAEY, 2ª ED, capítulo 6, Seções 6.1 e 6.2.
WESTE: 4.4.1 Logical Effort:



(a) $C_{in} = 3$
 $g = 3/3$



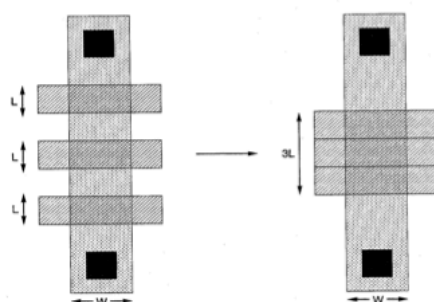
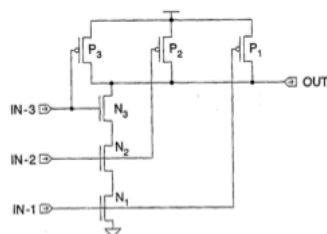
(b) $C_{in} = 5$
 $g = 5/3$



(c) $C_{in} = 7$
 $g = 7/3$

FIGURE 4.22 Logic gates sized for unit resistance

Transistors in Series: CMOS NAND



- Several devices in series each with effective channel length L_{eff} can be viewed as a single device of channel length equal to the combined channel lengths of the separate series devices
 - e.g. 3 input NAND: a single device of channel length equal to $3L_{eff}$ could be used to model the behavior of three series devices each with L_{eff} channel length, assuming there is no skew in the increasing gate voltage of the three N pull-down devices.
 - The source/drain junctions between the three devices essentially are assumed as simple zero resistance connections
 - During saturation transient, the bottom two devices will be in their linear region and only the top device will be pinched off.

R. W. Knepper
SC571, page 4-26

FINAL DO LAB NAND-NOR